

Chronologie des événements marquants dans la progression de nos produits industriels

En 1919, nous avons commencé à fabriquer nos premiers microscopes pour les sciences de la vie. Dix ans plus tard, nous étendions au domaine industriel la technologie de microscopie que nous avions développée. Le reste appartient à l'histoire!

- | | |
|---|---|
|  | <p>1929 Première incursion d'Olympus dans le domaine de l'inspection industrielle grâce au microscope métallographique MC</p> |
|  | <p>1955 Lancement de notre premier microscope pour la métrologie, le micro-interféromètre MI</p> |
|  | <p>1968 Lancement des appareils de la série IFS, nos premiers produits industriels d'inspection visuelle à distance (RVI), lesquels tirent parti des développements technologiques de notre secteur médical</p> |
|  | <p>1973 Lancement du Panametrics Model 5221, premier mesureur d'épaisseur à ultrasons commercial au monde offrant la fonction de mesure multimode et d'étalonnage de la vitesse de propagation</p> |
|  | <p>1984 Lancement de l'EPOCH® 2002, premier appareil de recherche de défauts portable entièrement numérique au monde</p> |
|  | <p>1988 Lancement du 22DL, premier mesureur d'épaisseur au monde muni d'un enregistreur de données intégré</p> |
|  | <p>1994 Lancement de l'EPOCH III, notre premier appareil de recherche de défauts par ultrasons conventionnels portable à offrir des fonctions de gestion de fichiers et d'enregistrement intégré de données</p> <ul style="list-style-type: none"> └ Lancement de l'OLS1000, notre premier microscope laser |
|  | <p>2001 Lancement de l'XT, notre premier analyseur XRF portable</p> <ul style="list-style-type: none"> └ Lancement de la série de vidéoscopes très prisés IPLEX™ |
|  | <p>2003 Lancement de l'appareil de recherche de défauts OmniScan®, premier appareil portable de ce type dans le domaine des inspections à ultrasons multiéléments</p> |
|  | <p>2008 Lancement des analyseurs XRD BTX® et TERRA®, dont la conception est enfin suffisamment compacte pour l'utilisation sur une table de travail ou sur le terrain</p> |
|  | <p>2010 Lancement de l'appareil de recherche de défauts EPOCH 60, qui est portable, fonctionnel et robuste</p> |
|  | <p>2011 Lancement de l'OmniScan MX2, l'appareil de recherche de défauts par ultrasons portable le plus vendu</p> |
|  | <p>2012 Lancement de la série DSX, premiers microscopes numériques</p> |
|  | <p>2014 Lancement de l'appareil de recherche de défauts par courants de Foucault NORTEC® 600</p> |
|  | <p>2016 Lancement du Vanta™, premier analyseur XRF portable conçu pour être conforme à l'indice de protection IP64/65</p> <ul style="list-style-type: none"> └ Lancement du vidéoscope IPLEX NX, qui marque le début de l'inspection visuelle à distance en haute définition (HD RVI™) |
|  | <p>2017 Lancement de l'EPOCH 6LT, notre appareil de recherche de défauts par ultrasons offrant la plus grande portabilité jusqu'ici</p> <ul style="list-style-type: none"> └ Mise en œuvre de la plateforme Olympus Scientific Cloud™, qui marque une nouvelle étape en matière d'accès infonuagique |